

[首页](#)[机构](#)[成果](#)[学者](#)

中国科学院机构知识库网格

Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid

[登录](#) [注册](#)

CAS IR Grid / 上海应用物理研究所 / 中国科学院上海应用物理研究所 / 中科院上海应用物理研究所2004-2010年

用于掠入射XAFS方法的样品台

文献类型: 专利

入库方式: OAI收割

来源: [上海应用物理研究所](#)

浏览

373

下载

81

收藏

0

作者 魏向军; 李丽娜; 于海生; 黄宇营; 姜政; 高倩

专利国别 中国

专利类型 发明专利

中文摘要 本发明提供一种用于掠入射XAFS方法的样品台, 包括由上至下依次连接的样品支架、第一角位台、第二角位台、旋转台、升降台和平移台, 所述旋转台和平移台分别由与一控制系统相连的电机控制, 所述旋转台和所述平移台上分别设有与所述控制系统相连的光栅尺。本发明用于掠入射XAFS方法的样品台, 对样品的旋转角度和平移位置实现闭环控制, 进而精确调整X射线的穿透深度, 提高了表面及薄膜样品掠入射XAFS谱的采集信噪比。

学科主题 G01N23/223

公开日期 2013-01-23

语种 中文

专利申请号 CN201210074161

专利代理 邓琪

源URL [<http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/10625>]

专题 上海应用物理研究所_中科院上海应用物理研究所2004-2010年

推荐引用方式 魏向军,李丽娜,于海生,等. 用于掠入射XAFS方法的样品台.

GB/T 7714

[其他版本](#)

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

[欧盟学术资源开放存取平台](#) | [CALIS高校机构知识库](#) | [台湾学术机构典藏](#) | [香港机构知识库整合系统](#) | [网站地图](#) | [意见反馈](#)

版权所有 ©2023 中国科学院 - 运行维护: 中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace

[0931-8270076发送邮件](#)

陇ICP备2021001824号-8

甘公网安备 62010202001088号